

APPENDIX 1

The lower detection limits of element measurements by the methods applied

WD-XRF (%)													
SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	SO ₃	Cl	F	LOI
0.1	0.01	0.05	0.01	0.001	0.01	0.01	0.01	0.01	0.001	0.01	0.001	0.01	0.1
ICP-MS (ppm)													
La	Ce	Pr	Nd	Eu	Sm	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
0.5	0.5	0.5	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Sc	Y	Ag	As	Ba	Be	Cd	Co	Cs	Cr	Cu	Li	Mo	Ni
0.5	0.5	0.1	2	2	0.05	0.5	0.5	0.05	2	0.5	0.5	0.5	0.5
ICP-MS (ppm)										GF AAS (ppb)			
Pb	Rb	Sb	Se	Sn	Sr	Tl	U	V	Zn	Au	Pd	Pt	
5	0.05	0.5	2	1	0.5	0.05	0.05	5	5	1	5	10	